## Особенности фазового перехода в кристаллах слабого сегнетоэлектрика Li<sub>2</sub>Ge<sub>7</sub>O<sub>15</sub>

© А.Ю. Кудзин, М.Д. Волнянский, И.А. Бусоул

Днепропетровский государственный университет, 320625 Днепропетровск, Украина

(Поступила в Редакцию 21 апреля 1997 г.)

Длительный период времени проводятся исследования сравнительно мало изученного класса сегнетоэлектриков, получивших название слабых. Малая величина спонтанной поляризации Ps приводит к ряду особенностей физических свойств этих кристаллов при температуре фазового перехода Т<sub>с</sub>. Типичным представителем слабых сегнетоэлектриков является германат лития Li<sub>2</sub>Ge<sub>7</sub>O<sub>15</sub> (LGO). *P*<sub>s</sub> в этих кристаллах составляет всего  $0.03 \,\mu\text{C/cm}^2$ , а величина постоянной Кюри–Вейсса  $C_{CW}$ равна 4.6 К [1]. Исследование диэлектрических и механических свойств LGO показало, что это несобственный сегнетоэлектрик с фазовым переходом (ФП) второго рода [2]. Низкое значение  $C_{CW}$  является признаком  $\Phi\Pi$ типа упорядочения. Детальные исследования температурной зависимости теплоемкости кристаллов LGO [3], которые позволили определить избыточную энтропию при  $\Phi\Pi$  (1.0 J/m · K), свидетельствуют в пользу перехода типа смещения.

Противоречивые результаты дают также оптические и диэлектрические исследования. Исследования инфракрасных спектров поглощения и комбинационного рассеяния позволили обнаружить колебательные мягкие моды в LGO как выше, так и ниже  $T_C$ . Нейтронографические [4] и рентгенографические [5] исследования показали, что в процессе ФП происходит смещение кислородных тетраэдров, содержащих ион германия, относительно кислородного октаэдра. В процессе такого смещения величина P<sub>s</sub> оказывается очень малой. Однако при этом обеспечивается лишь малая часть диэлектрической проницаемости ( $\varepsilon$ ) [6] при  $T_C$ . Сравнительно высокое значение  $\varepsilon$  при  $T_C$  связывается с релаксационными процессами, которые проявляются в значительной частотной дисперсии  $\varepsilon$  в области  $T_C$  в гигагерцовом диапазоне длин волн [7]. Природа этой дисперсии предположительно связывается с литиевой подрешеткой кристалла.

Дополнительная аномалия  $\varepsilon$ , проявляющаяся в сильном температурном гистерезисе, отмечалась в [8]. Многие расхождения в результатах исследований, выполненных разными авторами, могут быть связаны с несовершенством кристаллов, как это отмечалось в [3]. Все это является, по нашему мнению, основанием для дальнейших исследований свойств LGO.

В настоящей работе представлены результаты исследований диэлектрических свойств монокристаллов LGO, выращенных методом Чохральского. Отличительной особенностью исследованных образцов была высокая степень совершенства, достигнутая использованием особо чистых реактивов, подбором состава шихты и режима выращивания.

На рис. 1 представлена зависимость  $\varepsilon$  от температуры LGO, измеренной на частоте 1 kHz при охлаждении (кривая 1) и нагревании (кривая 2). При охлаждении  $\varepsilon$  в максимуме ( $\varepsilon_{m1}$ ) достигает значения 350, что почти на порядок превышает ранее опубликованные данные [1]. Значение  $\varepsilon$  в максимуме ( $\varepsilon_{m2}$ ), полученное в процессе нагревания образца, значительно ниже величины  $\varepsilon_{m1}$ . На эти величины сильное влияние оказывают температура и время выдержки образца в сегнетоэлектрической фазе. Результаты рис. 1 получены после выдержки кристалла в течение часа при -263 К. Для получения воспроизводимых результатов образцы подвергались длительному (до 10h) отжигу при температуре 353-373 К. Многократное циклирование образца в интервале температур 283–293 К приводит к постепенному снижению  $\varepsilon_{m1}$  до 250 и ниже. Закон Кюри-Вейсса выполняется (при охлаждении) в интервале температур 0.25 К выше и 0.15 К ниже *T<sub>C</sub>*, а при нагревании — в интервале 0.75 К выше и 0.25 К ниже Т<sub>с</sub>. Величины С<sub>СW</sub> (при охлаждении) равны 5.8 и 2К, а (при нагревании) 4.4 и 1К соответственно



**Рис. 1.** Зависимость диэлектрической проницаемости LGO от температуры. *1* — охлаждение, *2* — нагрев.

(рис. 2). Полученные параметры кристаллов существенно отличаются от опубликованных ранее в [2].

Известно, что большое число часто определяющее влияние на свойства сегнетоэлектриков оказывают их доменная структура и ее изменение при изменении температуры и других внешних воздействиях. Поэтому были предприняты исследования, направленные на выяснение влияния этого фактора. LGO — одноосный сегнетоэлектрик, вектор Р<sub>s</sub> которого направлен вдоль направления [001], что не позволяет выявить доменную структуру оптическими методами. Для выявления роли доменной структуры и получения косвенной информации о доменном состоянии кристалла проводились исследования влияния воздействия сильного поляризующего электрического поля, приложенного на время выдержки образца в сегнетоэлектрическом состоянии, и оценки изменения заряда поляризации методом измерения пироэлектрических токов. Измерения пиротока выполнялись общепринятым квазистатическим методом при равномерном нагревании (охлаждении) образца. Результаты этих измерений представлены на рис. 3. Неотожженный образец и при нагреве, и при охлаждении обнаруживает пиросигнал одного знака. Вблизи ФП зависимость *P<sub>s</sub>* от температуры квадратичная. Интегральный заряд, который освобождается при охлаждении (нагревании), с точностью до погрешности измерений (~ 10%) равен величине  $P_s$ . Этот результат показывает, что неотожженные кристаллы имеют монодоменное или близкое к нему состояние. Отжиг кристаллов полностью изменяет вид температурной зависимости пиротока. При охлаждении



**Рис. 2.** Зависимость обратной диэлектрической проницаемости LGO от температуры. 1 -охлаждение, 2 -нагрев.  $\varepsilon_0 -$ диэлектрическая проницаемость при T = 293 К.



**Рис. 3.** Температурная зависимость пиротока кристаллов LGO до (1, 2) и после (3, 4) отжига. 1, 3 — охлаждение, 2, 4 — нагрев.

(нагреве) наблюдается изменение знака пиротока вблизи  $T_C$ . Это свидетельствует о многодоменном состоянии образца. Суммарная величина заряда, протекающего в цепи, составляет не более 10% от величины  $P_s$ . Это свидетельствует о том, что неотожженные кристаллы имеют многодоменную структуру с примерно равным количеством антипараллельных доменов. Измерения зависимости  $\varepsilon$  на моно- и полидоменных образцах дают практически одинаковые результаты. Таким образом, наблюдаемые особенности поведения  $\varepsilon$  не могут быть объяснены доменными процессами. Полученные результаты исключают также высказанное в [8] предположение о внутреннем поле деполяризации как о причине температурного гистерезиса  $\varepsilon$ .

Представленные результаты указывают на то, что в  $\varepsilon$ LGO вносят вклад два механизма. Один — решеточный, связанный с мягкой модой, второй — релаксационный. Заряды, определяющие этот релаксационный механизм поляризации кристалла, увеличивает поляризуемость при структурном переходе. Кроме того, после перехода кристалла в поляризованное состояние идет дальнейшее его упорядочение, приводящее к запоминанию образцом факта пребывания в поляризованном сегнетоэлектрическом состоянии. Ввиду большого значения  $\varepsilon$  в пике концентрация этих релаксирующих зарядов должна быть высокой, что дает основание считать релаксирующими зарядами в LGO ионы лития. Предварительные исследования частотной зависимости  $\varepsilon$  в мегагерцовом диапазоне частот указывают на частотную дисперсию  $\varepsilon_{m1}$ , что также указывает на релаксационную природу добавочной части  $\varepsilon_{m1}$ .

Таким образом, в результате проведенных исследований существенно уточнены параметры кристаллов германата лития, изучены особенности поведения  $\varepsilon$  в области сегнетоэлектрического ФП, обнаружен вклад релаксационного механизма поляризации в  $\varepsilon$ .

## Список литературы

- [1] M. Wada. Ind. J. Appl. Phys. 26, 68 (1988).
- [2] M. Wada, Y. Yshibashi. J. Phys. Soc. Jap. 52, 193 (1983).
- [3] Б.А. Струков, М.Ю. Кожевников, Е.Л. Сорока, М.Д. Волнянский. ФТТ **32**, *9*, 2823 (1990).
- [4] Y. Iwata, I. Shubuya, M. Wada, A. Sawada, Y. Yshibashi. Jap. J. Appl. Phys. 24, 597 (1985).
- [5] H. Terauchi, S. Jida, Y. Nishihaba, M. Wada, A. Sawada, Y. Yshibashi. J. Phys. Soc. Jap. 52, 2312 (1983).
- [6] A. Sawada, M. Wada, K. Fujta, H. Toibana. Jap. J. Appl. Phys. 24, 534 (1985).
- [7] M. Horioka, A. Sawada, M. Wada. J. Phys. Soc. Jap. 58, 10, 379 (1989).
- [8] A.Yu. Kudzin, D.F. Bajsa, D.M. Volnyanskii, B. Garbarz. Ferroelectrics. **172**, 449 (1995).